







(J-PARC/JAEA) 明午 伸一郎、山口 雄司、岩元 大樹

日本加速器学会 2024年7月31 山形テラス





●宇宙用半導体デバイス試験のための施設

- 陽子ビーム照射施設計画
- 陽子供給法の検討

● 宇宙での荷電粒子スペクトロメータの試験

- ビーム窓の散乱を利用した試験
- 測定結果と考察







- 宇宙衛星の需要は急激に高まる
- シングルイベント効果(Single Event Effect : SEE)
 の発生は致命的になるため地上試験が重要



ユーロコンサル: 小型・超小型衛星の打上げ 需要調査 内閣府 宇宙政策委員会 宇宙産業・科学技術基盤部会 第39回会合(2018)

- ・ 最大フラックス粒子: 陽子
 ・ 通信衛星の打上げ活発
- ・ 放射線の影響が少ない
 低軌道 (< 0.3 Re)
 <p>民生品(COTS品)活用



半導体デバイスに対する宇宙放射線照射効果 高橋 REAJ Vol 36 8 pp. 450 (2014)



- 幅広いエネルギー(数
 MeV~数百 MeV程
 度)の陽子照射が可
 能な試験施設が必要
 大気中の試験が必要
 国内の照射機会が圧
 倒的に不足
 ⇒ 宇宙開発基金
- N. A. Dodds+, IEEE Trans on Nucl. Sci, 62, 6, 2440 (2015)

J-PARC陽子ビーム照射施設(計画)











レーザー荷電変換(H⁻-> H⁰) + 磁場中の分離によるビーム取出し
 大気中での陽子照射試験







陽子ビーム施設の陽子供給法に関する検討







dE4

dE5

200

400

245

385

302

432

ビーム窓の散乱陽子 スペクトル測定



- プラスティクシンチレータ(EJ200)を5台(dE1-E5)をテレスコープ型として設置
- AI窓から14 m離れた散乱角度13°(水平5.6°, 垂直11.8°)の位置に設け、スペクトルをカロリメトリックに 測定(デジタイザStruct SIS3316) ※但し400 MeVまで
- パイルアップ防止のため、通常運転より7桁程度低いビーム強度 (~107個/shot)を使用

Plastic scintillators \Box 50 mm

3NBTビームダンプ(RCS出口)



- エネルギーを変化させ0.4~3 GeVの試験が可能
- ただしスペクトルの測定が必要









Ep 300 MeV

Ep 400 MeV 一次陽子エネルギー(大気中 350 MeV)







- 核計算モデル高度化のため²⁷Al(p,xp)反応の二重微分断面積(DDX)が重要であるが、データは少ない
 ※ 1 GeV以上の入射陽子のデータは一例のみ、物理的に解釈できない怪しいデータ
- DDXの導出:陽子輸送のエネルギー損失や非弾性散乱による減衰の考慮が必要
 ⇒ デコンボリューション(アンフォールディング)によりDDXを導出
- 応答関数行列: PHITS 計算 (JQMD), アンフォールディング: RooUnfoldを用いたベイズ推定法を適用

M = *RS*, M: 測定值, R: 応答関数行列, S: DDX











- 明確な陽子測定が観測されたが、弾性散乱と準弾性散乱が明確な分離が困難
- 今後の解析:400 MeV以下のデータを取得







 RIA, TOTELA, PHITS, Niitaのシステマティック, JENDL-HE2007と比較 RIA: Relativistic Impulse Approximation 千葉先生(東エ大) JENDL-HE2007 ENDF utility(国枝氏, JAEA 核データセンター)

²⁷Al(p,p) 10⁶ dơ/dΩ (mb/sr) RIA TOTELA 10⁵ PHITS JENDL-HE 10 0.424 GeV Heiberg+ (1957) 0.725 GeV McManiga+ (1965) 10³ 10² 10 0.725 GeV x 10⁻² 10 10⁻² 10^{-3} 10⁻⁴ 10 15 20 25 30 Lab. angle (degree)

- 実験データ E<0.73 GeVのみ
- RIA, PHITS, JENDL-HE 実験とよい一致



- PHITS : E<1 GeVで仁井田のシステマティックを使用
 E≥1 GeV 別のシステマティックを使用
- 将来の測定で明確にする予定

JAXAおよびNICTの荷電粒子検出器試験



3 GeV

チェレンコフ放射に基づくスペクトル測定

β: 光速比(v/c)、n: 屈折率 チェレンコフ光 ∝ (β²n²-1)^{-1/2}(βn)⁻²



JAXA・J-PARCおよびNICT・J-PARCと共同研究契約を結び、2023年3月より試験を開始



NICT CHARMS-pの試験結果



提供: 大辻、NICT

CHARMS-p EMモデルの試験



- NICTの工学モデル(EM)の試験を完了
- フライトモデル(FM)の試験を将来実施予定
- 宇宙開発計画に貢献した







- 今後高い需要が予測される宇宙用半導体デバイス試験のため、陽子ビーム照射施設での検討
 - ディグレータ減速+磁場による単色化:

デバイス試験で必要な数MeV~400 MeV供給の可能性を得た。

- 宇宙用スペクトロメータの試験: ビーム窓の散乱陽子を利用した方法の高度化
 - 400 MeV陽子入射のAl(p,xp)反応の二重微分断面積(DDX)を取得し、計算モデルとの比較検討
 - JAXA・NICT 宇宙用スペクトロメータ試験を開始
- 今後の課題:
 - 陽子ビーム照射施設: 陽子輸送の詳細な検討
 - ●ビーム窓の散乱:数GeV陽子のスペクトル測定+断面積測定